

G01R 電気的変量の測定；磁気的変量の測定 (共振回路の正しい同調の指示 H 0 3 J 3 / 1 2)

注

(1) サブクラスは、以下のものを包含する：

すべての種類の電気的変量もしくは磁気的変量の直接測定または他の電気的変量もしくは磁気的変量からの派生による測定；

物質のすべての種類の電気的または磁気的性質の測定；

電気的もしくは磁気的な装置、器具もしくは回路網(例・放電管、増幅器)の試験またはそれらの性質の測定；

電流または電圧の存在または符号の指示；

NMR, EPR またはスピン効果装置で、特殊な用途に特に適用されていないもの；[5]

このような試験および測定を行うために用いられる信号を発生するための装置

(2) このサブクラスにおいては、下記の用語または表現は以下に示す意味で用いる：

“測定”とは調査を含む；

“計器”または“測定計器”とは“電気機械的測定機構”を意味する；

“測定のための装置”とは“測定のための装置、回路または方法”を意味する。

(3) クラス G 0 1 のタイトルに続く注に注意すること。

(4) このサブクラスにおいては、電気的変量の測定のための機器または装置は、以下のように分類される：[8]

電気機械装置は、2 以上の測定値の結果を合わせたものを含め、測定された電気的変量が測定値の表示に直接影響を与える場合、グループ 5 / 0 0 ~ 1 1 / 0 0 に分類される。[8]

グループ 5 / 0 0 ~ 1 1 / 0 0 に包含される異なるタイプの装置に共通する細部は、グループ 1 / 0 0 に分類される。[8]

電気的変量の抽出、算出または他の処理、例・別の測定値との比較、により測定値を表示させる回路を含む装置は、1 7 / 0 0 ~ 2 9 / 0 0 に分類する。[8]

グループ 1 7 / 0 0 ~ 2 9 / 0 0 に包含される異なるタイプの装置に共通する細部は、グループ 1 5 / 0 0 に分類される。[8]

(5) このサブクラスにおいては、グループ 1 7 / 0 0 はグループ 1 9 / 0 0 から 3 1 / 0 0 に優先する。

サブクラス内の索引

電気測定器

一般 5/00, 7/00, 9/00

細部 1/00

製造、較正、試験 3/00; 35/00

電力または電流の時間積分の電気機械的測定 11/00

電気的変量の測定

測定装置の細部 11/02, 15/00

表示装置 13/00

参照値との比較を含むもの 17/00

電流または電圧；電力、力率；電力または電流の時間積分；周波数；抵抗，リアクタンス，インピーダンス

..... 19/00; 21/00; 22/00; 23/00; 27/00

他の変量 25/00, 29/00

電気的性質の試験または故障位置の発見 31/00

磁気的変量の測定 33/00

1/00 グループ G 0 1 R 5 / 0 0 ~ G 0 1 R 1 3 / 0 0 または G 0 1 R 3 1 / 0 0 に包含される型の機器または装置の細部(電気的消費の電気機械的測定装置に特有の構造的細部 G 0 1 R 1 1 / 0 2) [3 , 8]

1/02 ・一般的な構造の細部

1/04 ・ハウジング；支持部材，端子装置

1/06 ・測定用導線；測定用探針 (G 0 1 R 1 9 / 1 4 5 , G 0 1 R 1 9 / 1 6 5 が優先) [3]

1/067 ・測定用探針 [3]

1/07 ・非接触構造探針 [6]

1/073 ・複合探針 [3]

1/08 ・指針；目盛板；目盛板の照明

1/10 ・軸受装置

1/12 ・条片または線状軸受装置

1/14 ・制動装置；減衰装置

1/16 ・磁石

1/18 ・電界または磁界に対する遮蔽装置，例・地球の場に対するもの

1/20 ・電気測定器において使用する基礎的電気要素の変更；このような要素の計器との構造的結合

1/22 ・電流変成器の 2 次巻線として動作する挟み試験具

1/24 ・伝送線，例・導波管，を測定するための部分，例・溝を有する部分

1/26 ・探針の直線の動きによるもの

1/28 ・測定計器における参照値，例・基準電圧，基準波形，用設備

1/30 ・基礎的電子回路，例・増幅器と電気測定計器との構造的結合

1/36 ・電気的測定計器に対する過負荷保護装置または回路

1/38 ・指示特性を変更するための装置，例・空隙を加減するもの

1/40 ・ある時間々隔で到達した最大値または最小値を指示するための計器の変更，例・最大値指示指針によるもの [3]

1/42 ・熱的に動作するもの

1/44 ・温度補償のための計器の変更 [2]

3/00 測定計器の製造に対して特に適合した装置または方法

5/00 単一の電流または単一の電圧を機械的変位に変換するための計器

5/02 ・可動コイル計器

5/04 ・外部磁石型

5/06 ・内部磁石型

5/08 ・広角度の偏位に特に適合するもの；偏

G 0 1 R

	心して軸支された可動コイルによるもの		節手段 [2]
5/10	・単線検流計	11/18	・・・・周囲の状態の変化に対する補償 [2]
5/12	・環状検流計	11/185	・・・・温度補償 [2]
5/14	・可動鉄片計器	11/19	・・・・外乱トルクによる誤差，例．多相型計器の回転磁界誤差，に対する補償 [2]
5/16	・・・・軸支された磁石によるもの		
5/18	・・・・軸支された軟鉄心によるもの，例．指針検流計	11/20	・・・・誘導型計器の位相誤差に対する補償 [2]
5/20	・誘導型装置，例．フェラリス型装置	11/21	・・・・電流の制動作用による誤差に対する補償，例．過負荷調整 [2]
5/22	・熱型計器		
5/24	・・・・条片もしくは線の伸びまたはガスもしくは液体の膨脹により動作するもの	11/22	・・・・トルクの調整，例．始動トルクの調整，等価トルクを得るための多相型計器の調整 [2]
5/26	・・・・パイメタル素子の変形により動作するもの	11/23	・・・・摩擦による誤差の補償，例．軽負荷調整 [2]
5/28	・静電型装置		
5/30	・・・・箔検電器	11/24	・・・・不正使用を回避または指示する装置 [4]
5/32	・・・・線電位計；指針電位計	11/25	・・・・故障の指示または信号発生装置 [2 ， 4]
5/34	・・・・象限電位計		
7/00	2 以上の電流または電圧を単一の機械的変位に変換しうる計器（ G 0 1 R 9 / 0 0 が優先）		注 グループ G 0 1 R 1 1 / 4 8 から G 0 1 R 1 1 / 5 6 はグループ G 0 1 R 1 1 / 3 0 から G 0 1 R 1 1 / 4 6 に優先する。 [4]
7/02	・和または差を形成させるためのもの	11/30	・電流力計
7/04	・商を形成するためのもの（抵抗測定 G 0 1 R 2 7 / 0 8 ）	11/32	・・・・積算電力計
7/06	・・・・可動鉄片型	11/34	・・・・積算電流計
7/08	・・・・可動コイル型，例．交叉コイル型	11/36	・誘導型計器，例．フェラリス型計器
7/10	・・・・3 個以上の可動コイルを有するもの	11/38	・・・・単相用
7/12	・積を形成するためのもの	11/40	・・・・多相用
7/14	・・・・可動鉄片型	11/42	・・・・その回路
7/16	・・・・固定と可動コイルの両方を有するもの，例．電流力計型計器	11/46	・電氣的に動作する時計機構を有する計器；振動型計器；振り子型計器
7/18	・・・・固定と可動コイルとを磁氣的に結合する鉄心をもつもの	11/48	・有効分または無効分を測定するのに特に適合した計器；皮相エネルギーを測定するのに特に適合した計器
9/00	機械的共振を用いる計器	11/50	・・・・有効分を測定するためのもの
9/02	・振動型検流計，例．電流測定用	11/52	・・・・無効分を測定するためのもの
9/04	・振動片を使用するもの，例．周波数測定用	11/54	・・・・次の三変量のうち少なくとも二つを同時に測定するためのもの：有効成分，無効成分，皮相エネルギー
9/06	・・・・磁氣的に駆動されるもの		
9/08	・・・・圧電氣的に駆動されるもの [2 0 0 6 ， 0 1]	11/56	・特殊料金計器
		11/57	・・・・多種料金計器（ G 0 1 R 1 1 / 6 3 が優先） [2]
11/00	電力または電流の時間積分，例．消費，を測定する電気機械的装置（電氣的推進車両の電氣的消費の監視 B 6 0 L 3 / 0 0 ）	11/58	・・・・そのための料金切換装置 [2]
11/02	・構造的細部	11/60	・・・・減算計器；最大または最小の負荷時間を測定する計器
11/04	・・・・ハウジング；支持ラック；端子装置	11/63	・・・・超過消費計器，例．所定の電力を超過した間の消費を測定するもの [2]
11/06	・・・・誘導型計器の磁気回路 [2]		
11/067	・・・・そのためのコイル [2]	11/64	・・・・最大需要計器，例．ある時間の料金がその期間内の最大需要に基づくもの
11/073	・・・・そのための回転子 [2]		
11/09	・・・・円板型回転子 [2]	11/66	・・・・回路
11/10	・・・・制動磁石；減衰装置	13/00	電氣的変量または波形の表示装置 [4]
11/12	・・・・軸受装置	13/02	・デジタル形で測定された電氣的変量を表示するためのもの [4]
11/14	・・・・磁氣的な軽減によるもの		
11/16	・・・・電気計器へのカウンターの適合	13/04	・永久的に記録するためのもの [4]
11/17	・・・・誤差の補償；そのための調整または調		

13/06	・ 過渡じょう乱を記録するための変更， 例．記録媒体を発進または加速すること によるもの	15/16	・ 容量装置を使用するもの [6]
13/08	・ 機械的に直接書く方法をもつ電気機械 的記録方式	15/18	・ インダクタ，コイルを使用するもの， 例．変成器 [6]
13/10	・ ストロークの長さまたは点の位置に より変数を表示する間欠的記録をもつもの	15/20	・ 磁電変換素子を使用するもの，例．ホ ール効果素子 [6]
13/12	・ 化学的記録，例．クライドノグラフ (G 0 1 R 1 3 / 1 4 が優先)	15/22	・ 発光素子を使用するもの，例．L E D ， ホトカプラ [6]
13/14	・ 感光性材料に記録	15/24	・ 光変調器を使用するもの [6]
13/16	・ 磁気材料に記録	15/26	・ 光以外の波の変調を使用するもの，例． 電波または音波 [6]
13/18	・ 境界の変位を使用するもの	17/00	参照値で比較する測定装置，例．ブリッジ
13/20	・ 陰極線オシロスコープ	17/02	・ 測定値が自動的に参照値と比較される装 置
13/22	・ そのための回路	17/04	・ 参照値が連続的または周期的に測定値 の範囲を掃引されるもの
13/24	・ 時間軸偏向回路	17/06	・ 自動平衡装置
13/26	・ 電子ビームの強さを制御するための 回路	17/08	・ 測定値を表わす力またはトルクが参 照値を表わす力またはトルクと平衡する もの
13/28	・ 2 以上の変数の同時または連続的表 示のための回路	17/10	・ 交流または直流測定ブリッジ
13/30	・ 基準マーカを挿入するための回路， 例．時間基準用，目盛の較正用，周波数 の目盛づけ用	17/12	・ 電流の比較を使うもの，例．差の電流 出力をもつブリッジ
13/32	・ 過渡状態のような非反覆的関数を表 示する回路；トリガー回路；同期回路； 時間軸拡大回路	17/14	・ 較正目盛零指示計により測定値を指示 するもの，例．パーセントブリッジ，許 容差ブリッジ (G 0 1 R 1 7 / 1 2 ， G 0 1 R 1 7 / 1 6 が優先)
13/34	・ サンプルングにより単一の波形を表 現する回路，例．超高周波に対するもの [2]	17/16	・ ブリッジの一つまたはそれ以上の辺に 放電管または半導体装置をもつもの，例． 差動増幅器を使用する電圧計
13/36	・ グロー放電の長さを用いるもの，例．グ ロー・オシロスコープ [4]	17/18	・ 五辺以上もつもの
13/38	・ 電気機械測定系による光ビームの一定変 位または振動変位を使用するもの [4]	17/20	・ 交流または直流電位差計測定装置
13/40	・ 機械的変位による以外に光ビームの変調 を利用するもの，例．カー効果によるもの [4]	17/22	・ 較正目盛零指示計により測定値を指示 するもの
13/42	・ スパークの長さを利用する計器，例．ス パークを起こす最大の電極間距離を測定 するもの	19/00	電流または電圧を測定し，またはその存在 または符号を指示するための装置 (G 0 1 R 5 / 0 0 が優先；生体の電流または電 圧を測定するためのもの A 6 1 B 5 / 2 4) [2 0 0 6 . 0 1]
15/00	グループ G 0 1 R 1 7 / 0 0 ~ G 0 1 R 2 9 / 0 0 ， G 0 1 R 3 3 / 0 0 ~ G 0 1 R 3 3 / 2 6 または G 0 1 R 3 5 / 0 0 に定 めた形式の測定装置の細部 [1 ， 8]		
15/04	・ 分圧器 [6]	<u>注</u>	
15/06	・ 無効成分をもつもの，例．容量型分圧 器 [6]	グループ 1 9 / 0 2 ~ 1 9 / 3 2 内では，1 9 / 2 8 が優先す る。グループ 1 9 / 1 8 ~ 1 9 / 2 5 はグループ 1 9 / 0 2 ~ 1 9 / 1 6 5 および 1 9 / 3 0 に優先する。 [3]	
15/08	・ 測定範囲を変えるための回路	19/02	・ 実効値の測定，すなわち二乗平均の開平 値
15/09	・ 自動レンジ変更 [6]	19/03	・ 熱変換器の使用 [4]
15/12	・ テスタ回路，例．電圧，電流，インピー ダンスを随意に測定するためのもの	19/04	・ 交流またはパルスのピーク値の測定 [2]
15/14	・ 電圧または電流の絶縁計測に適合するもの， 例．高電圧回路または大電流回路用 [6]	19/06	・ 有効成分の測定；無効成分の測定
		19/08	・ 電流密度の測定
		19/10	・ 和，差または比の測定
		19/12	・ 変化率の測定
		19/14	・ 電流の方向指示；電圧極性指示
		19/145	・ 電流または電圧の存在の指示 [3]
		19/15	・ 電流の存在の指示 [3]

19/155	・電圧の存在の指示 [3]	21/133	・デジタル技術を用いるもの [4]
19/165	・電流または電圧が所定のレベル以上であるかまたは以下であるか、あるいは所定の範囲内にあるかまたは範囲外にあるかの指示 [3]	21/14	・温度変化に対する補償 [2]
19/17	・その発生度数の指示を与えるもの [3]	22/00	電力または電流の時間積分の測定装置 , 例 . 電気計器 [4 , 8]
19/175	・電流または電圧が所定の値を通過する , 例 . 零点を通過する , 時を指示するもの [3]	注 電力の時間積分を測定するための装置は , 本質的特徴が電力測定にある場合には , グループ 2 1 / 0 0 に分類する。 [4]	
19/18	・直流の交流への変換を使うもの , 例 . チョッパーをもつもの	22/02	・電解的方法によるもの [4]
19/20	・変換器を使用するもの	22/04	・熱量測定法によるもの [4]
19/22	・交流の直流への変換を使うもの	22/06	・電子的方法によるもの [8]
19/25	・デジタル測定技術を使用するもの [3]	22/08	・アナログ手法を使用するもの [8]
19/252	・電圧または電流を周波数に変換し , この周波数を測定する形式のアナログ / デジタル変換器を用いるもの [4]	22/10	・デジタル手法を使用するもの [8]
19/255	・電圧また電流に比例する期間の間に固定周波数のパルス発生器により送られるパルスを計数する形式のアナログ / デジタル変換器を用いるもの [4]	23/00	周波数測定装置 ; 周波数スペクトル分析装置
19/257	・電圧または電流の値を異なる基準値と比較する形式のアナログ / デジタル変換器を用いるもの , 例 . ステップ・バイ・ステップ法を用いるもの [4]	23/02	・周波数測定装置 , 例 . パルス繰り返し率 ; 電流または電圧の周期測定装置
19/28	・分布定数回路の測定に適応されるもの	23/04	・分布定数回路の測定に適応されるもの
19/30	・ある度間々隔で到達した電流または電圧の最大値または最小値の測定 (G 0 1 R 1 9 / 0 4 が優先) [2 , 3]	23/06	・周波数を電流または電圧の振幅に変換することによるもの
19/32	・温度変化に対する補償 [2]	23/07	・共振に同調した回路のレスポンスを使用するもの , 例 . グリッドディップメーター [2]
21/00	電力または力率の測定装置 (G 0 1 R 7 / 1 2 が優先) [4]	23/08	・共振から外れた回路のレスポンスを使用するもの
21/01	・分布定数回路におけるもの (G 0 1 R 2 1 / 0 4 , G 0 1 R 2 1 / 0 7 , G 0 1 R 2 1 / 0 9 , G 0 1 R 2 1 / 1 2 が優先) [2]	23/09	・アナログ積分器 , 例 . 入力信号と規定量の放電信号またはリークの平衡により平均値を生ずるコンデンサ , を使用するもの [2]
21/02	・熱的方法によるもの [2]	23/10	・周波数を計数されるパルス列に変換することによるもの
21/04	・分布定数回路におけるもの	23/12	・周波数を位相推移に変換することによるもの
21/06	・電流および電圧の測定によるもの (G 0 1 R 2 1 / 0 8 ~ G 0 1 R 2 1 / 1 3 3 が優先) [4]	23/14	・ヘテロダインによるもの ; ビート周波数比較によるもの [2]
21/07	・分布定数回路におけるもの (G 0 1 R 2 1 / 0 9 が優先) [2]	23/15	・パルスの周波数が所定値以上または以下 , もしくは数値の所定範囲内または所定範囲外であることを , 非線形またはデジタル要素を用いることによって , 指示するもの [3]
21/08	・感磁性効果素子 , 例 . ホール効果素子 , を使用するもの [2]	23/16	・スペクトル分析 ; フーリエ分析
21/09	・分布定数回路におけるもの [2]	23/163	・分布定数回路の測定に適したものの [3]
21/10	・既知インピーダンス負荷により吸収される電力を測定するために回路素子 , 例 . ダイオード , の二乗特性を使用するもの (G 0 1 R 2 1 / 0 2 が優先) [2]	23/165	・濾波器を使用するもの [3]
21/12	・分布定数回路におけるもの	23/167	・デジタル濾波器を有するもの [3]
21/127	・パルス変調を用いるもの (G 0 1 R 2 1 / 1 3 3 が優先) [4]	23/17	・光学的補助装置を有するもの [3]
		23/173	・掃引パノラマ受信機に類似の揺動装置 [3]
		23/175	・遅延手段 , 例 . 中間接点付遅延線 , によるもの [3]
		23/177	・超低周波数の分析 [3]
		23/18	・周波数スペクトルを記録する装置をもつもの
		23/20	・非線形歪の測定
		25/00	電圧と電流間または電圧間または電流間の

	位相角を測定する装置 [2]	29/033	・・・その発生度数の指示を与えるもの[3]
25/02	・分布定数回路	29/04	・波形率の測定，すなわち実効値と算術平均の比；波高率の測定，すなわち最大値と実効値の比
25/04	・所定の位相差，例．零位相差，をつくる移相器の調節装置をもつもの	29/06	・変調度の測定
25/06	・比率計を使うもの	29/08	・電磁界の特性測定
25/08	・基準パルスの計数によるもの [2]	29/10	・アンテナの輻射線図
27/00	抵抗，リアクタンス，インピーダンスまたはそれらから派生する電気的特性を測定する装置	29/12	・静電界の測定
27/02	・実数または複素抵抗，リアクタンス，インピーダンス，またはそれらから誘導される二端子特性，例．時定数，を測定するもの（位相角のみを測定することによるもの G 0 1 R 2 5 / 0 0 ）	29/14	・電界分布の測定
27/04	・分布定数回路におけるもの	29/16	・多相回路網の非対称性の測定
27/06	・・・・反射係数の測定；定在波比の測定	29/18	・相順の指示；同期指示
27/08	・電圧と電流を測定することによる抵抗の測定	29/20	・巻数の測定；変成比または巻線の結合係数の測定
27/10	・・・・商を形成する二コイルまたは交叉コイル計器を使用するもの	29/22	・圧電特性の測定
27/12	・・・・手動発電機を使用するもの，例．メガー	29/24	・電荷量測定装置 [2]
27/14	・参照電源から得られた電流または電圧の測定による抵抗の測定（ G 0 1 R 2 7 / 1 6 ， G 0 1 R 2 7 / 2 0 ， G 0 1 R 2 7 / 2 2 が優先）	29/26	・雑音指数の測定；信号対雑音比の測定 [2]
27/16	・電流が他の電源から流れている素子または回路網，例．ケーブル，電力線，のインピーダンス測定	31/00	電気的性質を試験するための装置；電気的故障の位置を示すための装置；試験対象に特徴のある電気的試験用の装置で，他に分類されないもの（製造中に半導体装置または固体装置を試験もしくは測定するもの H 1 0 P 7 4 / 0 0 ；有線伝送方式の試験 H 0 4 B 3 / 4 6 ）[2 0 0 6 . 0 1]
27/18	・・・・対地抵抗を測定するもの		
27/20	・接地抵抗の測定；大地との接続部，例．地板，の接触抵抗の測定		
27/22	・流体の抵抗測定		
27/26	・インダクタンスまたはキャパシタンスの測定；Qの測定，例．共振法によるもの；損失係数の測定；誘電率の測定		
27/28	・減衰，利得，移相，または四端子回路網，すなわち二端子対回路網から派生する特性の測定；過渡応答の測定（有線伝送方式におけるもの H 0 4 B 3 / 4 6 ）		
27/30	・特性を記録する装置をもつもの，例．ナイキスト線図を書くことによるもの		
27/32	・分布定数回路におけるもの [2]		
29/00	グループ G 0 1 R 1 9 / 0 0 ～ G 0 1 R 2 7 / 0 0 に包含されない電気量を指示または測定する装置		
29/02	・個々のパルスの特性，例．パルスの平坦さからのずれ，立上り時間または持続時間 [2 0 0 6 . 0 1]		
29/027	・パルス特性が所定値以上であるかまたは以下であるか，あるいは所定の範囲内にあるかまたは範囲外にあるかの指示 [3]		
		注	
		注 [2 0 2 0 . 0 1]	
		グループ G 0 1 R 3 1 / 0 8 , G 0 1 R 3 1 / 1 2 , G 0 1 R 3 1 / 3 2 7 , G 0 1 R 3 1 / 2 4 , G 0 1 R 3 1 / 2 6 , G 0 1 R 3 1 / 3 4 , G 0 1 R 3 1 / 3 6 , G 0 1 R 3 1 / 4 0 , G 0 1 R 3 1 / 4 4 はグループ G 0 1 R 3 1 / 5 0 が優先。	
		31/01	・類似の物品を順次に試験するもの，例．大量生産における“合格／不合格”試験；対象物が試験場所を通過する際に試験を行うもの（試験装置を連続的に通過するケーブルの試験 G 0 1 R 3 1 / 5 9 ；絶縁耐力または破壊電圧の試験 G 0 1 R 3 1 / 1 2 ）[2 0 2 0 . 0 1]
		31/08	・ケーブル，伝送線，または回路網の故障個所の検出 [2 0 2 0 . 0 1]
		31/10	・故障点の破壊を増大させることによるもの，例．特殊なプログラムを働かすパルスの発生器を使用して燃焼させるもの [2 0 0 6 . 0 1]
		31/11	・パルス反射法を用いるもの
		31/12	・絶縁耐力または破壊電圧の試験 [2 0 2 0 . 0 1]
		31/14	・そのための回路
		31/16	・試験容器の構造；そのための電極
		31/18	・類似物品を順次に試験するもの，例．大量生産における“合格／不合格”試験
		31/20	・試験を容易にするための物品または標本の準備
		31/24	・放電管の試験（製造中のもの H 0 1 J 9 / 4 2 ）[2 0 2 0 . 0 1]

- 31/25 ・ ・ 真空管の試験 [2]
- 31/26 ・ 個々の半導体装置の試験 (製造中または
処理中の試験または測定 H 1 0 P 7 4 /
0 0 ; 光電圧装置の試験 H 0 2 S 5 0 /
1 0) [2 0 2 0 . 0 1]
- 31/265 ・ ・ 非接触試験 [6]
- 31/27 ・ ・ 回路の一部を形成している素子の回路
から物理的に取り外さないままの, 例 .
周囲の要素からの影響を補正した, 試験
[6]
- 31/28 ・ 電子回路の試験, 例 . シグナルトレーサ
ーによるもの (待機作動中または遊休時
間中のコンピュータの検査 G 0 6 F 1 1
/ 2 2)
- 31/30 ・ ・ 限界試験, 例 . 供給電圧を変えること
によるもの (待機作動中または遊休時間
中のコンピュータの検査 G 0 6 F 1 1 /
2 2) [2]
- 31/302 ・ ・ 非接触試験 [5]
- 31/303 ・ ・ ・ 集積回路におけるもの (G 0 1 R 3
1 / 3 0 5 ~ G 0 1 R 3 1 / 3 1 5 が優先) [6]
- 31/304 ・ ・ ・ プリント回路またはハイブリッド回
路におけるもの (G 0 1 R 3 1 / 3 0 5
~ G 0 1 R 3 1 / 3 1 5 が優先) [6]
- 31/305 ・ ・ ・ 電子ビームを用いるもの [5]
- 31/306 ・ ・ ・ プリント回路またはハイブリッド
回路におけるもの [6]
- 31/307 ・ ・ ・ 集積回路におけるもの [6]
- 31/308 ・ ・ ・ 非イオン電磁放射, 例 . 光線, を用
いるもの [5]
- 31/309 ・ ・ ・ プリント回路またはハイブリッド
回路におけるもの [6]
- 31/311 ・ ・ ・ 集積回路におけるもの [6]
- 31/312 ・ ・ ・ 容量法によるもの [5]
- 31/315 ・ ・ ・ 誘導法によるもの [5]
- 31/316 ・ ・ アナログ回路の試験 [6]
- 31/3161 ・ ・ ・ 限界試験 [6]
- 31/3163 ・ ・ ・ 機能試験 [6]
- 31/3167 ・ ・ アナログデジタル混在回路の試験 [6]
- 31/317 ・ ・ デジタル回路の試験 [6]
- 31/3173 ・ ・ ・ 限界試験 [6]
- 31/3177 ・ ・ ・ 論理回路の試験, 例 . ロジック・ア
ナライザによるもの [6]
- 31/3181 ・ ・ ・ 機能試験 (G 0 1 R 3 1 / 3 1 7 7
が優先) [6]
- 31/3183 ・ ・ ・ 試験入力, 例 . テストベクトル,
パターンまたはシーケンス, の発生 [6]
- 31/3185 ・ ・ ・ 試験のための構成変更, 例 . L S
S D , 回路分割 [6]
- 31/3187 ・ ・ ・ ビルトインテスト [6]
- 31/319 ・ ・ ・ テスターハードウェア, すなわち,
出力処理回路 [6]
- 31/3193 ・ ・ ・ ・ 実際のレスポンスと既知の正確
なレスポンスとの比較によるもの [6]
- 31/327 ・ 回路電流断続器, スイッチまたは回路遮
断器の試験 [6]
- 31/333 ・ ・ 高電圧回路遮断器の開閉容量の試験 [6]
- 31/34 ・ 発電機, 電動機の試験 [2 0 2 0 . 0 1]
- 31/36 ・ 蓄電池または電池の電気的状態, 例 . 容
量または充電状態 [S o C], の試験, 測
定または監視のための装置 [2 0 2 0 .
0 1]
- 31/364 ・ ・ 測定装置と一体化されたバッテリータ
ーミナルコネクタ [2 0 1 9 . 0 1]
- 31/367 ・ ・ 試験, 測定または監視のためのソフト
ウェア, 例 . 電池試験のためのモデリン
グまたはルックアップテーブルを用いる
もの [2 0 1 9 . 0 1]
- 31/371 ・ ・ 遠隔表示をともなうもの, 例 . 外部充
電器で表示するもの [2 0 1 9 . 0 1]
- 31/374 ・ ・ 温度または経年変化に応じて測定値を
補正する手段を有するもの [2 0 1 9 .
0 1]
- 31/378 ・ ・ 電池または蓄電池の種類に特に適合し
たもの [2 0 1 9 . 0 1]
- 31/379 ・ ・ ・ 鉛蓄電池に特に適合したもの [2 0
1 9 . 0 1]
- 31/382 ・ ・ 電池または蓄電池の変量を監視するた
めの装置, 例 . S o C [2 0 1 9 . 0 1]
- 31/3828 ・ ・ ・ 電流積算を用いるもの [2 0 1 9 .
0 1]
- 31/3832 ・ ・ ・ 電池電圧を測定しないもの [2 0
1 9 . 0 1]
- 31/3835 ・ ・ ・ 電圧の測定のみによるもの [2 0 1
9 . 0 1]
- 31/3842 ・ ・ ・ 電圧と電流の測定を組み合わせるも
の (G 0 1 R 3 1 / 3 8 2 8 が優先) [2
0 1 9 . 0 1]
- 31/385 ・ ・ 電池または蓄電池の変量を測定するた
めの装置 (監視用 G 0 1 R 3 1 / 3 8 2)
[2 0 1 9 . 0 1]
- 31/387 ・ ・ ・ 充電容量 [A h] または S o C の判
定 [2 0 1 9 . 0 1]
- 31/388 ・ ・ ・ 電圧の測定を含むもの [2 0 1 9 .
0 1]
- 31/389 ・ ・ 内部インピーダンス, 内部導電率また
は関連する変量の測定 [2 0 1 9 . 0 1]
- 31/392 ・ ・ 電池の経年変化または劣化の判定, 例 .
S o H [2 0 1 9 . 0 1]
- 31/396 ・ ・ 電池内の個々のセルまたはセルのグル
ープを試験または監視するためのデータ
の取得または処理 [2 0 1 9 . 0 1]
- 31/40 ・ 電源の試験 (光電圧装置の試験 H 0 2 S
5 0 / 1 0) [2 0 2 0 . 0 1]
- 31/42 ・ ・ A C 電源 [6]

31/44	・ランプの試験 [2 0 2 0 . 0 1]	33/032	・磁気光学装置, 例. ファラデー, を使用するもの [3]
31/50	・短絡, 導通, 漏電または誤配線のための電気機器, 導電線, ケーブルまたは構成要素の試験 (スパークプラグの試験 H 0 1 T 1 3 / 5 8) [2 0 2 0 . 0 1]	33/035	・超電導装置を使用するもの [3]
31/52	・短絡, 漏電または地絡のための試験 [2 0 2 0 . 0 1]	33/038	・永久磁石を使うもの, 例. 天秤, ねじり装置 [3]
31/54	・導通のための試験 [2 0 2 0 . 0 1]	33/04	・フラックスゲート法を使うもの
31/55	・誤配線のための試験 [2 0 2 0 . 0 1]	33/05	・薄膜素子によるもの [3]
31/56	・電気機器の試験 (変圧器の試験 G 0 1 R 3 1 / 6 2, 接続部の試験 G 0 1 R 3 1 / 6 6) [2 0 2 0 . 0 1]	33/06	・電流磁気装置を使用するもの
31/58	・導電線, ケーブルまたは導体の試験 (電気巻線の試験 G 0 1 R 3 1 / 7 2) [2 0 2 0 . 0 1]	33/07	・ホール効果装置を使用するもの [6]
31/59	・ケーブルが試験装置を連続的に通過する間, 例. 製造中, の試験 [2 0 2 0 . 0 1]	33/09	・磁気抵抗装置を使用するもの [6]
31/60	・多芯ケーブル中のワイヤの識別 [2 0 2 0 . 0 1]	33/10	・磁界分布をプロットするもの
31/62	・変圧器の試験 [2 0 2 0 . 0 1]	33/12	・物品または固体もしくは流体の標本の磁気的性質の測定 (磁気共鳴を含むもの G 0 1 R 3 3 / 2 0) [4]
31/64	・キャパシタの試験 [2 0 2 0 . 0 1]	33/14	・ヒステリシスカーブの測定またはプロット
31/66	・接続部, 例. プラグまたは切り離しのできないジョイント, の試験 (誤配線のための試験 G 0 1 R 3 1 / 5 5) [2 0 2 0 . 0 1]	33/16	・磁化率の測定
31/67	・電気機器または回路内のワイヤ接続の正しさの試験 [2 0 2 0 . 0 1]	33/18	・磁歪特性の測定
31/68	・取外し可能な接続部, 例. プリント回路基板上に取り付けられた端子, の試験 [2 0 2 0 . 0 1]	33/20	・磁気共鳴をとともなうもの (医療用 A 6 1 B 5 / 0 5 5 ; 磁気共鳴ジャイロメータ G 0 1 C 1 9 / 6 0) [4 , 5]
31/69	・ケーブルまたはワイヤハーネスの終端の端子の試験; プラグの試験; ソケット, 例. 壁付けソケットまたは電気機器における電源ソケット, の試験 [2 0 2 0 . 0 1]	33/24	・磁界または磁束の方向または大きさを測定するためのもの [4]
31/70	・構成要素とプリント回路基板との間の接続部の試験 (G 0 1 R 3 1 / 6 8 が優先) [2 0 2 0 . 0 1]	33/26	・オプティカルポンピングを使用するもの [4]
31/71	・はんだ接合部の試験 [2 0 2 0 . 0 1]	33/28	・グループ G 0 1 R 3 3 / 4 4 ~ G 0 1 R 3 3 / 6 4 に分類される装置の細部 [5]
31/72	・電気巻き線の試験 (変圧器の試験 G 0 1 R 3 1 / 6 2) [2 0 2 0 . 0 1]	33/30	・試料取扱い装置, 例. 試料セル, 回転機構 [5]
31/74	・ヒューズの試験 [2 0 2 0 . 0 1]	33/31	・その温度制御 [6]
33/00	磁気的変量を測定する計器または装置	33/32	・励起または検出システム, 例. 高周波を使用するもの [5]
33/02	・磁界または磁束の方向または大きさの測定 (G 0 1 R 3 3 / 2 0 が優先) [4]	33/34	・構造的細部, 例. 共振器 [5]
33/022	・傾度の測定 [3]	33/341	・表面コイルからなるもの [6]
注		33/3415	・サブコイルの配列からなるものの [6]
グループ 3 3 / 0 2 2 または 3 3 / 1 0 はグループ 3 3 / 0 2 5 ~ 3 3 / 0 6 に優先する。		33/343	・スリットを有するものまたはループギャップ型のもの [6]
33/025	・浮遊磁界の補償 [3]	33/345	・導波管型のもの (G 0 1 R 3 3 / 3 4 3 が優先) [6]
33/028	・電気力学的磁力計 [3]	33/36	・電氣的細部, 例. コイルと受信器との整合または結合 [5]
		33/38	・主磁場または傾斜磁場の発生, 均質化または安定化のためのシステム [5]
		注	
		グループ 3 3 / 3 8 5 ~ 3 3 / 3 8 9 はグループ 3 3 / 3 8 1 ~ 3 3 / 3 8 3 に優先する。 [6]	
		33/381	・電磁石を使用するもの [6]
		33/3815	・超電導コイルを有するもの, 例. そのための電源 [6]
		33/383	・永久磁石を使用するもの [6]
		33/385	・傾斜磁場コイルを使用するもの [6]

G 0 1 R

- 33/387 ・・・・磁場の不均一性の補償 [6]
- 33/3873 ・・・・強磁性体を使用するもの [6]
- 33/3875 ・・・・補正コイル組み立て体を用いる
もの、例．能動シム [6]
- 33/389 ・・・・磁場の安定化 [6]
- 33/42 ・・・・遮蔽 [5 , 6]
- 33/421 ・・・・主磁場または傾斜磁場の遮蔽 [6]
- 33/422 ・・・・高周波磁場の遮蔽 [6]
- 33/44 ・核磁気共鳴 [NMR] を用いるもの (G
0 1 R 3 3 / 2 4 , G 0 1 R 3 3 / 6 2
が優先) [5]
- 33/46 ・・・・NMR分光計 [5]
- 33/465 ・・・・生物学的材料に適用するもの、例．
ガラス器内での試験、すなわちインピト
ロ [6]
- 33/48 ・・・・NMR画像システム [5]
- 33/483 ・・・・特定の体積領域からの信号または
スペクトルを選択するもの、例．生体分
光、すなわちインピボ [6]
- 33/485 ・・・・化学シフト情報に基づくもの [6]
- 33/50 ・・・・緩和時間の測定に基づくもの [5]
- 33/54 ・・・・信号処理システム、例．パルスシ
ーケンス [5]
- 33/56 ・・・・画像の強調または補正、例．減
算または平均化技術 [5]
- 33/561 ・・・・走査時間の減少によるもの、
すなわち、高速データ収集システム、例．
エコープレーナパルスシーケンス [6]
- 33/563 ・・・・移動物質の画像の強調または
補正、例．血管強調造影、すなわちアン
ギオグラフィー [6]
- 33/565 ・・・・画像歪曲の補正、例．磁場の
不均一性によるもの [6]
- 33/567 ・・・・生理的信号によりゲート制御
するもの [6]
- 33/58 ・・・・画像システムの校正、例．テスト
探針を使用するもの [5]
- 33/60 ・電子常磁性共鳴を用いるもの (G 0 1
R 3 3 / 2 4 , G 0 1 R 3 3 / 6 2 が優
先) [5]
- 33/62 ・二重共鳴を用いるもの (G 0 1 R 3 3
/ 2 4 が優先) [5]
- 33/64 ・サイクロトロン共鳴を用いるもの (G
0 1 R 3 3 / 2 4 が優先) [5]
- 35/00 このサブクラスの他のグループに包含され
る装置の試験または較正 [2]
- 35/02 ・補助装置、例．規定された変成比、位相
角、定格電力に従った計器用変成器、に
関するもの
- 35/04 ・電力または電流の時間積分を測定する計
器に関するもの
- 35/06 ・ストロボスコープ法によるもの